

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE ARTT. 76, COMMA 5, LETTERA A) E 29, COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del C.N.R., Strada VIII n. 5 – 95121 Catania.

RUP: Dott. Rosario Corrado Spinella

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

Denominazione della gara: **GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON MODALITA' TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE ADOGGETTO LA FORNITURA IN LOTTO UNICO DI UN "SISTEMA FIB-SEM" (FOCUSED ION BEAM –SCANNING ELECTRON MICROSCOPE) DA CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI CATANIA DELL'ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DENOMINATO "BEYOND_NANO"**

CUP: G66J17000350007

CIG: 91887181F9

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

Importo a base d'asta: € 757.300,00 oltre IVA

Oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze: € 0,00

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

Offerte ricevute: n° 1 – FEI ITALIA SRL con sede legale in Milano, Viale Monte Nero nr. 84, cap 20135, p.i. 11944100152

Aggiudicatario: FEI ITALIA SRL con sede legale in Milano, Viale Monte Nero nr. 84, cap 20135, p.i. 11944100152

Valore finale dell'appalto: € 755.000,00 (eurosettecentocinquantacinquemila/00) oltre IVA

Provvedimento di aggiudicazione: Prot. N 5160 del 01.07.2022

Subappalto: No

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sicilia, Catania

Ufficio presso il quale sono disponibili gli atti: Segreteria dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Tel. +39-0955968211 – gare@imm.cnr.it

**Il Direttore IMM-CNR
Dott. Vittorio Privitera**